

電子顕微鏡解析技術フォーラム

「得られたデータを最大限に活用する！電子顕微鏡で捉えられる情報を再確認！」

2018年8月24日(金)～8月25日(土)合宿形式

開催地：六甲保養荘（兵庫県西宮市越水社家郷山1-95）

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な問題点をざっくばらんに話し合う場として《電子顕微鏡解析技術フォーラム》を開催いたします。

今年の夏のフォーラムでは、テーマを「得られたデータを最大限に活用する！電子顕微鏡で捉えられる情報を再確認！」と題し、像観察(カメラ、検出器)、EELS、軟X線分析について基礎的な部分から最新の技術まで広く学び、電子顕微鏡で得られるデータについての理解を深め、活用方法についてとことん議論します。

このフォーラムの特色である“ざっくばらんトーク”では、初の試みとしてEDS(EDX)に絞って疑問や質問を受け付け、EDS(EDX)メーカーの方にもご参加いただき、今後のご研究に役立つ議論をいたします。また、皆様の日頃のご研究成果などを発表していただく解析事例の紹介や課題の提案も募集します。

電子顕微鏡に携わる皆様、ふるってご参加ください！

= プログラム =

■ チュートリアル ■

- ・透過型電子顕微鏡用カメラと検出器の基礎
- ・透過電子顕微鏡における電子エネルギー損失分光法の実際

伊野家 浩司（日本ローパー）
木本 浩司（物質・材料研究機構）

■ トピックス ■

- ・電子チャネリング挙動に着目した収差補正 STEM 像の解釈
- ・軟X線分光器（SXES, SXES-ER）の原理と最新情報
- ・知らないものは測れない、予測しないものは見えない！－実用材のEELS分析のコツ－

木口 賢紀（東北大金材研）
村野 孝訓（日本電子）
武藤 俊介（名古屋大学）

■ その他 ■

- ・ざっくばらんトーク

今回はEDS(EDX)にテーマを絞って皆様からの疑問や質問を募集し、基本原理や実際の測定テクニック、スペクトルデータ解析の疑問点から最新技術までとことん議論します。

■ 解析事例の紹介 ■

『解析事例の紹介』今回のテーマと関係なく2件募集します。（発表時間：20分（質疑応答含む））

参加費(予定)：25,000円（日本顕微鏡学会個人・法人・協賛会員・学生）、30,000円（学会会員外）

定員：40名

申し込み締切：2018年7月23日(月)

参加ご希望の方は、e-mailまたはファクシミリで下記までお名前とご連絡先をお知らせください。

案内と申し込み用紙をお送りいたします。

事務局：日鉄住金テクノロジー(株) 水尾 有里 e-mail: mizuo-yuri@nsst.jp

電話：0439-80-3183 ファクシミリ：0439-80-2733

HP：<http://www.em-forum.sakura.ne.jp/>

電子顕微鏡解析技術分科会責任者：丸山 秀夫(カネカテクノロジー)

実行委員長：長澤 忠広(ライカマイクロシステムズ)

フォーラム実行委員：石丸 雅大(コベルコ科研)、乾 光隆(セイコーエプソン)、木村 耕輔(東レリサーチセンター)、
工藤 修一(東芝メモリ)、久芳 聡子(日本電子)、志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)、白井 学(日立ハイテクノロジー)、
高橋 知里(産総研)、水尾 有里(日鉄住金テクノロジー)、宮澤 知孝(東京工業大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、
村上 和歌子(リコー)、和田 充弘(三井金属)



日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会